

# КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СПЕКТРЫ СУЛЬФИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СОСТАВА $\text{La}_2\text{S}_3$

АБУТАЛЫБОВ Г.И., АБДУЛЛАЕВ И.И., ЛОЗИЦКИЙ С.А., МАМЕДОВ А.А.

*Институт Физики НАН Азербайджана*

Исследованы спектры пропускания и отражения в инфракрасной области, спектры комбинационного рассеяния полуторных сульфидов редкоземельных металлов  $\text{La}_2\text{S}_3$  и  $\text{Nd}_2\text{S}_3$ .

Одной из важных проблем квантовой электроники, является создание эффективных кристаллических миниатюрных лазеров, работающих в ИК-диапазоне. Создание миниатюрных лазеров в ИК-диапазоне ( $>2$  мкм), особенно работающих при комнатной температуре, составляет особый раздел в физике кристаллических лазеров. Это связано с рядом особенностей лазерных переходов в этой области спектра: как правило, малые сечения лазерных переходов, требующие высокой концентрации активатора для обеспечения необходимого коэффициента усиления, малые энергетические зазоры между уровнями переходов, приводящие к сильной конкуренции безызлучательных переходов по сравнению с излучательными.

Раньше в ИК-диапазоне работали лишь химические и газовые лазеры. Однако, уже очевидно, что наиболее перспективными кристаллами для создания лазеров в ИК-диапазоне, должны быть кристаллы, активированные редкоземельными ионами. Для создания миниатюрного лазера в ИК-диапазоне, нами было предложено использовать полупроводниковые кристаллы  $\text{La}_2\text{S}_3 - \text{P}^{3+}$ , и был проведен широкий круг спектрально-люминесцентных исследований кристаллов  $\text{La}_{2(1-x)}\text{Nd}_{2x}\text{S}_3$  [1].

Как отмечалось выше, с точки зрения создания кристаллических лазеров среднего ИК-диапазона наибольший интерес представляет изучение многофононных безызлучательных переходов в активных средах, поскольку они накладывают принципиальное ограничение на длину волны генерации в лазерах. Многофононные переходы играют существенную роль в формировании населённостей лазерных уровней. Строгий расчёт вероятностей многофононных безызлучательных переходов, как показано в работе [2], сложен и требует знания адекватной модели примесного центра, оператора электрон-фононного взаимодействия и сведений о примесно-активных фононах.

В данной статье представлены результаты исследований динамики кристаллической решетки кристаллов  $\text{La}_2\text{S}_3$  и  $\text{Nd}_2\text{S}_3$ .

Редкоземельные элементы (La) образуют с халькогенами (X) фазы (объемно-центрированная кубическая решетка, структурный тип  $\text{Th}_3\text{P}_4$  пространственная группа  $T_d^6 - \bar{1}\bar{4}3\bar{d}$ ; M=4) с граничными составами  $\text{La}_2\text{X}_3$  и  $\text{La}_3\text{X}_4$ . В пределах этих составов в решетке соединений имеются стехиометрические катионные вакансии  $V_k$ , распределенные в ней беспорядочно. Соединение в пределах фазы можно представить общей формулой  $\text{La}_{3-x}\text{V}_x\text{X}_4$ , где  $0 < x < 1/3$  [3].

Измерения спектров отражения  $\text{La}_2\text{S}_3$  в области от 2 до 50 мкм проводились на спектрофотометре Перкин-Эльмер, а  $\text{Nd}_2\text{S}_3$  на спектрометре фирмы Бекман ( модель 4260 ). В последнем случае для измерения отражения была изготовлена специальная приставка. Спектры КР возбуждались лазером на парах меди. Его основные характеристики таковы:

Частота следования импульсов	11 кГц
Длительность импульса	10 нс
Импульсная мощность	до 30 кВт
Средняя мощность	до 3 кВт
Длина волны излучения	510,5 и 578,2 нм

Поляризованное сфокусированное излучение через зеркало с отверстием направлялось на исследуемый образец.

Рассеянное излучение фокусировалось объективом на щель спектрометра, перед которой был установлен анализатор. Для получения спектра использовался двойной монохроматор фирмы «Speex» (модель 1403) с голографическими дифракционными решетками, обладающий крайне низким уровнем паразитного рассеянного света от возбуждающей линии ( $I_d/I_v < 10^{-14}$  при  $\Delta\nu > 20 \text{ см}^{-1}$ ). Максимальное спектральное разрешение для данного монохроматора составляло примерно  $0,15 \text{ см}^{-1}$ .

Сигнал КР на выходе спектрометра регистрировался фотоумножителем ФЭУ-79 (с мультищелочным фотокатодом). С выхода формирователя отобранные и стандартизованные одноэлектронные импульсы подавались на 1-й вход схемы совпадений. Второй канал служил для подачи стробирующих, стандартизованных импульсов на 2-й вход схемы совпадений. Линия задержки обеспечивала одновременный приход на схему совпадений стробирующего импульса и импульса сигнала КР. Временное окно схемы совпадений составляло  $t_{\text{ср}} = 10 \text{ нс}$ . Таким образом, счет фонов осуществлялся только в течение времени  $t_{\text{ср}}$ , равного в нашем случае длительности лазерного импульса, причем среднее число импульсов сигнала от одного возбуждающего лазерного импульса было, естественно, меньше единицы (временное разрешение ФЭУ-79 не превышало 10 нс). Формирователи счетных импульсов, линия задержки, а также схема совпадений представляли собой блоки, выполненные в стандарте NIM (фирма EG&G).

С выхода схемы совпадений импульсы сигнала подавались на цифровой счетчик фотонов, осуществляющий счет импульсов сигнала за выбранное время накопления и выдающий информацию в виде скорости счета импульсов сигнала (импульсы в секунду). Большая частота следования возбуждающих импульсов (11 кГц) давала возможность выбирать малые времена накопления схемы счета фотонов (0,2 - 1 с), что существенно сокращало время регистрации спектров КР. Далее сигнал в цифровом виде подавался на вход процессора "SCAMP", на экран дисплея которого в процессе эксперимента выводился спектр КР. С экрана дисплея спектры КР можно было переносить на магнитные диски. Вывод спектра КР на самописец можно было проводить как в процессе записи спектра, так и из магнитных дисков. Помимо обработки сигнала КР, процессор осуществлял также автоматическое управление шаговым двигателем поворота дифракционных решеток спектрометра при записи спектра КР, причем выбор режима записи проводился с клавиатуры процессора. Применение автоматизированной системы существенно сокращало время эксперимента и облегчало процедуру записи и обработки спектров КР, а также позволяло повысить соотношение сигнал/шум за счет использования режима многократного сканирования выбранного участка спектра.

На рис.1 показаны спектры отражения от кристаллов  $\text{La}_2\text{S}_3$  и  $\text{Nd}_2\text{S}_3$ . В спектре отражения  $\text{La}_2\text{S}_3$  в исследованной нами области частот структура оказывается плохо разрешенной, имеет вид широкой полосы без четко выраженных особенностей с максимумом отражения 75-80% при частотах  $\omega = 230-240 \text{ см}^{-1}$ .

Для определения оптических постоянных предполагалось, что спектр отражения обусловлен линейной комбинацией из  $N$  классических осцилляторов с затуханием. В этом случае комплексная диэлектрическая проницаемость определяется выражением.

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega) = \varepsilon_\infty + \sum_{i=1}^N \frac{\Delta\varepsilon_i \omega_{ri}^2}{\omega_{ri}^2 - \omega^2 + i\gamma_i \omega} \quad (1)$$

где  $\omega_{ri}$  – резонансная частота поперечной оптической моды  $i$ -го осциллятора с константой затухания  $\gamma_i$ , а  $\Delta\varepsilon_i = (\varepsilon_i - \varepsilon_\infty)$  – сила  $i$ -го осциллятора..

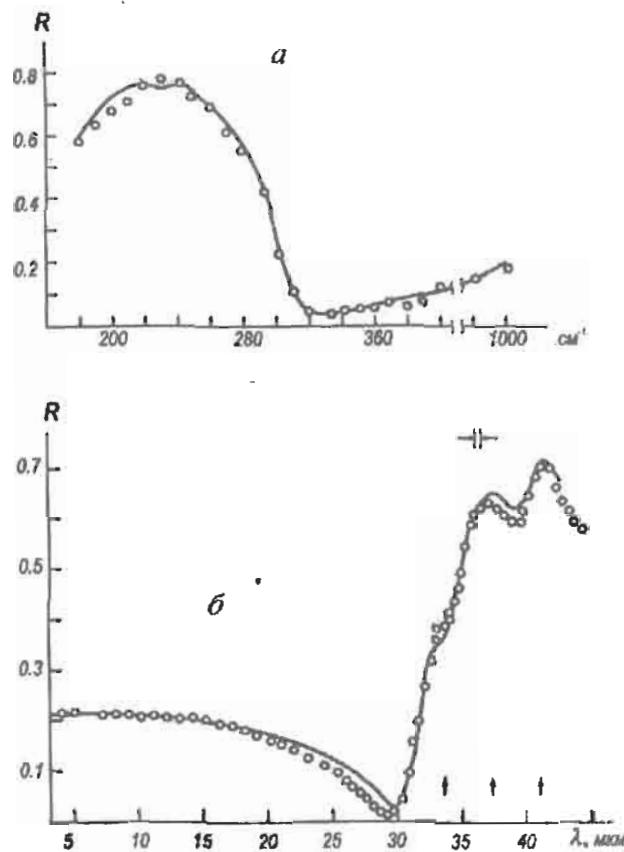


Рис. 1. Спектры отражения  $\text{La}_2\text{S}_3$  (а) и  $\text{Nd}_2\text{S}_3$  (б)

Параметры осцилляторов определяются путем подбора значений  $N$ ,  $\omega_{\text{TO}}$ ,  $\gamma$  и  $\Delta\epsilon_i$ , дающих наилучшее совпадение рассчитанного спектра отражения

$$R = \left( \frac{\epsilon^{1/2} - 1}{\epsilon^{1/2} + 1} \right)^2 \quad (2)$$

с экспериментальным. Оказалось, что в случае  $\text{La}_2\text{S}_3$  для хорошего аналитического описания их спектров отражения достаточно двух осцилляторов с параметрами, приведенными ниже:

$\text{La}_2\text{S}_3$	$\omega_{\text{TO}}, \text{cm}^{-1}$	$\gamma, \text{cm}^{-1}$	$\Delta\epsilon_i$	$\omega_{\text{LO}}, \text{cm}^{-1}$	$\epsilon_\infty$	$\epsilon_0$
	195	29,2	10,0	301	7,0	17,2
	230	23,0	0,2			

Продольная мода  $\omega_{\text{LO}}$  основного осциллятора определялась по положению  $\epsilon_1 = 0$ , где  $\epsilon_1$  действительная часть комплексной диэлектрической проницаемости. Большая разность  $\omega_{\text{TO}}$  и  $\omega_{\text{LO}}$  указывает на сильно выраженный полярный характер химической связи в  $\text{La}_2\text{S}_3$ .

В спектрах отражений, при длинах волн больше 30 мкм наблюдается пик селективного отражения со сложной структурой, типичный для ионных решеток. По

величине отражения в области прозрачности определяется показатель преломления  
 $n = (1 + \sqrt{R}) / (1 - \sqrt{R})$

Его значение в интервале диэлектрическую постоянную  $\lambda < 10\text{ мкм}$  позволили вычислить высокочастотную диэлектрическую постоянную  $\epsilon_{\infty} = n^2 = 7.0 \pm 0.2$ . Затем методом дисперсионного анализа (ДА) в модели 3-х осцилляторов с помощью ЭВМ были найдены частоты поперечных  $\omega_{\text{то}}$  и продольных  $\omega_{\text{ЛО}}$  оптических колебаний, времена жизни фононов  $\tau_{\phi}$ :

$\omega_{\text{ЛО}}$	$\omega_{\text{то}}$	$\tau_{\phi} \times 10^{13}, \text{с}$
250,9	243,9	6,6
292,3	270,2	2,08
338,4	298,5	1,9

Сущность метода ДА состоит в подгонке расчетного спектра отражения  $R_T$  к экспериментальному  $R_E$  с помощью метода наименьших квадратов, т.е. в минимизации среднеквадратичного отклонения. Расчеты проводились в варианте, рассмотренном в [4,5]. По значениям частот и  $\epsilon_{\infty}$ , была найдена статическая диэлектрическая постоянная

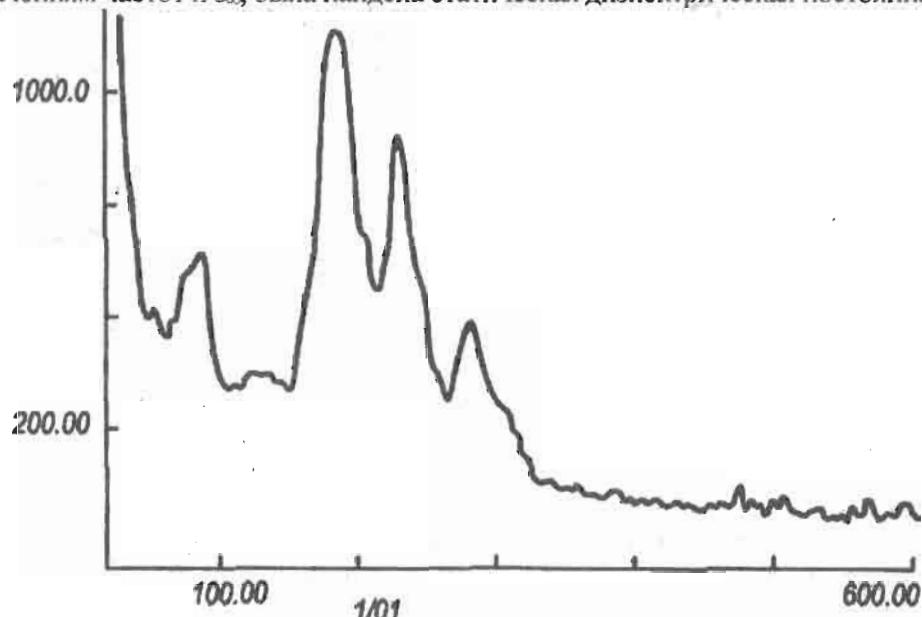


Рис.2. Спектр комбинационного рассеяния  $\text{La}_2\text{S}_3$

Для этого использовалась формула Лиддена-Сакса-Теллера. На рис.2 показан спектр КР кристалла  $\text{La}_2\text{S}_3$ . Ниже указано положение полос в спектрах КР  $\text{La}_2\text{S}_3$ :  
 $85\text{cm}^{-1}, 122\text{cm}^{-1}, 185\text{cm}^{-1}, 232\text{cm}^{-1}, 273\text{cm}^{-1}, 300\text{cm}^{-1}$

Частоты сильных полос  $122\text{cm}^{-1}, 185\text{cm}^{-1}, 232\text{cm}^{-1}, 273\text{cm}^{-1}, 300\text{cm}^{-1}$  в спектре КР совпали с частотами максимумов полос в ИК спектре поглощения. Спектры КР  $\text{Nd}_2\text{S}_3$  в стоксовой и антистоксовой областях приведены на рис.3. Запись производилась в неполяризованном и поляризованном свете при следующих ориентациях электрического вектора падающего и рассеянного света (в обозначениях Порто)  $Z(X, X)\bar{Z}$ ,  $Z(X, Y)\bar{Z}$ ,  $Z(X, XY)\bar{Z}$ .

Хотя опыты с поляризованным светом на блочных кристаллах не позволяют сопоставить частоты колебаний с определенным межатомными связями, тем не менее

они дают представление о наборе частот, характеризующих данный кристалл, и создают дополнительные условия для более уверенного выявления линий КР по сравнению с неполяризованными спектрами. В спектрах КР на рис.3 мы сочли возможным выделить шесть частот, которые указаны ниже:

$$90\text{cm}^{-1}, 142\text{cm}^{-1}, 196\text{cm}^{-1}, 245,3\text{cm}^{-1}, 297,3\text{cm}^{-1}, 357\text{cm}^{-1}.$$

Видно, что некоторые из них хорошо согласуются с частотами, найденными из измерений отражения и пропускания. Наблюдаемая зависимость интенсивности пиков от поляризации указывает на особенность отдельных колебаний, а также на проявление блочности.

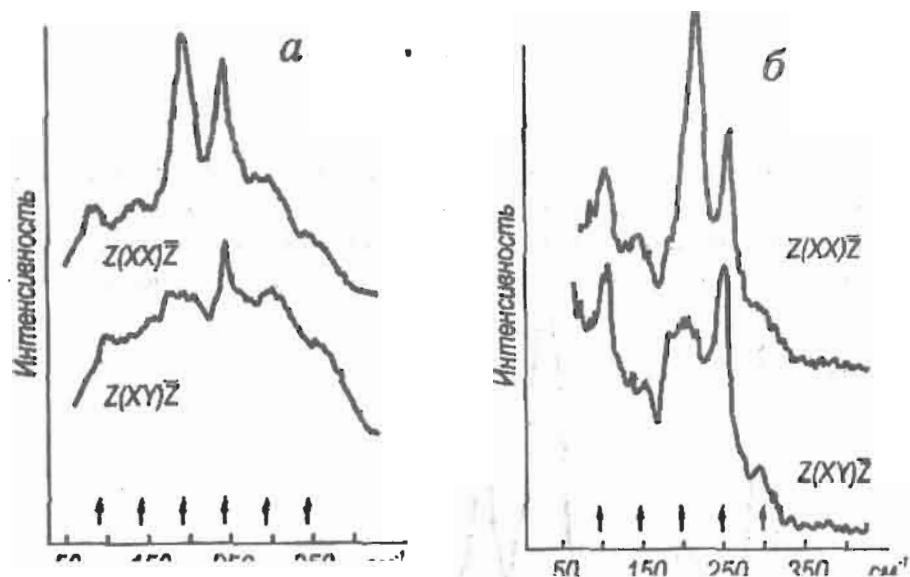


Рис. 3. Спектры КР  $y\text{-Nd}_2\text{S}_3$  с стоксовой (а) и антистоксовой (б) областях при различных поляризациях.

В работе [6] проведен теоретико-групповой анализ фононного спектра в кристаллах типа ТпзР4, имеющих пространственную группу симметрии  $T_d^6$ . Для представления  $T$  ( $k$ ,  $g$ ) было найдено следующее разложение на неприводимое представление в центре зоны Бриллюэна

$$T(\Gamma, g) = \Gamma_1 + 2\Gamma_2 + 3\Gamma_3 + 6\Gamma_4 + 5\Gamma_5.$$

Полученное разложение позволяет проанализировать характер фонового спектра. В частности, из того факта, что дипольный момент преобразуется по представлению  $\Gamma_4$  группы  $T_d^6$ , следует участие в однофоновых процессах поглощения света пяти оптических фононов  $\Gamma_4$ . Что касается КР, то было показано, что в однофонном рассеянии будут участвовать также пять оптических фононов  $\Gamma_4$ , три фонона  $\Gamma_3$  и один  $\Gamma_1$ . Отсюда следует, что в эксперименте следует ожидать пять колебаний  $\Gamma_4$ , активных одновременно в ИК и КР спектрах. Кроме частоты  $85\text{cm}^{-1}$ , все частоты в спектре комбинационного рассеяния кристалла  $\text{La}_2\text{S}_3$ , совпадают с частотами максимумов полос в ИК спектре поглощения. Опыты по отражению кристалла  $\text{Nd}_2\text{S}_3$  дают две частоты:  $244$  и  $298,5\text{cm}^{-1}$ , которые можно сопоставить с частотами  $245,3$  и  $297,3\text{cm}^{-1}$  в спектре КР. Что касается колебания  $270,2\text{cm}^{-1}$  в спектре отражения кристалла  $\text{Nd}_2\text{S}_3$ , то соответствующая ему частота

в КР не обнаруживается. Две частоты, активные в ИК спектре  $\text{Nd}_2\text{S}_3$ , 130 и  $363\text{cm}^{-1}$ , близки к частотам 142 и  $357\text{cm}^{-1}$  в спектре КР. Таким образом, одновременная активность в ИК и КР спектрах перечисленных выше частот дает основание отнести их к фононам типа  $\Gamma_4$ . Заметим, что колебания  $85\text{cm}^{-1}$  ( $\text{La}_2\text{S}_3$ ) и  $90\text{cm}^{-1}$   $\text{Nd}_2\text{S}_3$  могут быть приписаны связи S—S, для которой в кристаллической сере были получены частоты 82, 147, 215,  $470\text{cm}^{-1}$  [7]. Обоснованные суждения о принадлежности остальных колебаний в спектре КР должны опираться на опыты с однофазными ориентированными кристаллами.

В спектрах КР обращает на себя внимание необычно большая ширина линий. Причинами этого могут быть, в частности, структурное несовершенство или же аморфность кристалла и вследствие этого несоблюдение правил отбора [8]. Вероятнее первое предположение, так как для полуторных сульфидов характерна дефектность решетки из-за большого числа катионных вакансий. В таких кристаллах вследствие нарушения трансляционной симметрии условие равенства волновых векторов падающего и рассеянного света  $\mathbf{K}_1 = \mathbf{K}_2$  ( $\mathbf{q} = 0$ ) становится необязательным и заменяется условием  $\mathbf{k}_1 = \mathbf{k}_a + \mathbf{q}$ , где  $\mathbf{q}$  - волновой вектор фона. Таким образом, появляется возможность участия в рассеянии фонаров с любым  $\mathbf{q}$ , и амплитудная характеристика в спектре КР коррелирует с полностью фононных состояний в кристалле. Некоторым подтверждением этому является наблюдаемое на рис.3 совпадение спада интенсивности КР с частотой в стоксовом и антостоксовом спектрах, поскольку последний более явно связан с плотностью фононных состояний.

Остановимся еще на результатах, вытекающих из различия в поляризованных свойствах линий КР (рис. 3). Прежде всего, отметим, что существенная зависимость интенсивности линий от направления поляризации свидетельствует об анизотропии электрооптических свойств решетки  $\text{Nd}_2\text{S}_3$ . Далее из приближенной оценки степени деполяризации  $p = I_y/I_x$  можно заключить, что колебание с частотой  $196\text{cm}^{-1}$  имеет  $p \approx 0$  и может классифицироваться как полносимметричное. Для других, в частности, более высокоэнергетических колебаний оценка  $p$  затруднена, однако их с большим основанием можно отнести к последнему типу.

Таким образом, наши исследования показали, что у кристаллов  $\text{La}_2\text{S}_3$  и  $\text{Nd}_2\text{S}_3$  граница высокочастотных колебаний расположена ниже, чем у известных лазерных материалов. Поэтому на этих активированных  $\text{P}^{3+}$  ионами кристаллах возможна генерация более длинноволнового излучения.

- [1] А.А. Мамедов. Процессы возбуждения и релаксации  $\text{Nd}^{3+}$  в некоторых полупроводниковых матрицах.. Кандидатская диссертация. Москва 1984.
- [2] Андрюеш КС., Гамураль В.Я., Вылегжсанин Д.Н. и др. Электрон-фононное взаимодействие в  $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}\text{-Nd}^{3+}$  ФТГ.1972, т.14, №10 с.2967-2978.
- [3] Физические свойства халькогенидов редкоземельных элементов, под ред. В.П. Жузе, с.20. "Наука" Л. 1973.^
- [4] М.В. Белоусов, Д.Е. Погарев. Оптика и спектроскопия, 38, 1018, 1975
- [5] А.А. Кукарекни. Оптика и спектроскопия, 41, 499, 1976
- [6] Г.Ф. Караваев, А.В. Храпов. Изв. Вузов СССР, Физика, 11, 62, 1975
- [7] А.Т. Ward. J. Phys.Chem., 72 4133, 1968
- [8] Рассеяние света в твердых телах ( под ред. Кордоны ) гл.5 "Мир ", М.,1979

**La<sub>2</sub>S<sub>3</sub> NADİR TORPAQ METALLARI SULFİDLƏRİNİN RƏQS SPEKTRLƏRİ**

**ABUTALIBOV H.İ., ABDULLAYEV İ.İ., LOZİTSKİY S.A., MƏMMƏDOV A.A.**

La<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ve Nd<sub>2</sub>S<sub>3</sub> nadir torpaq metalları sulfidlerinin infraqırmızı oblastda buraxma ve qaytarma spektrləri həmçinin kombinasiya spektrləri tədqiq edilmişdir.

**VIBRATIONAL SPECTRUM OF SULFIDES RARE-EARTH  
METALS OF COMPOSITION La<sub>2</sub>S<sub>3</sub>**

**ABUTALIBOV G.I., ABDULLAYEV I.L, LOZITSKIY S.A., MAMEDOV A.A.**

In this work are investigated the spectra missing and reflection in infra-red area, spectra of combinational dispersion of La<sub>2</sub>S<sub>3</sub> and Nd<sub>2</sub>S<sub>3</sub> one-and-half sulphide rare-earth metals.